

ณัฐพงศ์ พิพา : การศึกษาประสิทธิภาพของเซลล์แสงอาทิตย์จากการสร้างลวดลายชั้นพาสซิเวชันด้วยเครื่องพิมพ์แบบพิคิด (STUDY OF SOLAR CELL EFFICIENCY FROM PASSIVATION LAYERS BY INKJET PRINTER) อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิพัฒน์ ฟังสุวรรณรักษ์, 138 หน้า.

การสร้างลวดลายขนาดเล็กของชั้นไดอิเล็กทริกบาง ๆ จากวัสดุซิลิคอนไดออกไซด์ (SiO_2) หรือซิลิคอนไนโตร (Si_3N_4) ที่อยู่ระหว่างแผ่นซิลิคอนฐานรองและชั้นไฟฟ้าโลหะด้านหลังของเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดซิลิคอนรอยต่อพี-เอ็น ทำให้เกิดสนามไฟฟ้าภายในบริเวณดังกล่าว เราเรียกว่าชั้นไดอิเล็กทริกนี้ว่าชั้นพาสซิเวชัน ส่งผลให้เกิดอัตราการรวมตัวของพาหะลดลง เนื่องจากความเร็วในการรวมตัวของพาหะลดลงและอายุของพาหะเพิ่มขึ้น ผลเหล่านี้มีส่วนช่วยให้ประสิทธิภาพการแปลงพลังงานของเซลล์แสงอาทิตย์สูงขึ้น แต่เนื่องจากข้อจำกัดด้านกระบวนการในการสร้างลวดลายที่ซับซ้อนจากเทคนิคโฟโตอลิทอกราฟี (photolithography) จึงไม่เหมาะสมกับอุตสาหกรรมการผลิตเซลล์แสงอาทิตย์ในเชิงพาณิชย์ งานวิจัยนี้จึงได้พัฒนาเครื่องพิมพ์แบบพิคิดให้สามารถสร้างลวดลาย SiO_2 ขนาดเล็ก บนวัสดุแผ่นฐานซิลิคอนเพื่อเป็นชั้นพาสซิเวชันที่ผิวด้านหลังให้แก่เซลล์แสงอาทิตย์ เทคนิคการฉีดตัวทำละลายสารไวแสงโดยตรงช่วยลดความซับซ้อนของการกระบวนการสร้างลวดลายขนาดเล็กได้และพร้อมพัฒนาสู่อุตสาหกรรมเชิงพาณิชย์ต่อไป

ในส่วนแรกของงานวิจัยได้พัฒนาเครื่องพิมพ์แบบพิคิดให้สามารถพิมพ์ลวดลายในแนวนอนลงบนแผ่นฐานเรียบแข็ง ได้ตามที่ออกแบบไว้จากคอมพิวเตอร์ และได้ศึกษาการสร้างชั้นเอ็นซิลิคอน ($n\text{-Si}$) บนแผ่นฐานซิลิคอนชนิดพี ($p\text{-Si}$) ด้วยวิธี spin on dopant (SOD) เพื่อให้เกิดรอยต่อพี-เอ็นขึ้น และได้ทำการสังเคราะห์ฟิล์มไดอิเล็กทริก SiO_2 จากการใช้สารละลาย TEOS และเคลือบบนแผ่นฐาน $p\text{-Si}$ ด้วยวิธีการเคลือบแบบหมุนเหวี่ยง (spin coating) จากนั้นได้ศึกษาการเปิดช่องเส้นตรงของฟิล์มสารไวแสง (photoresist) ชนิดบากที่เคลือบบนฟิล์ม SiO_2 ด้วยการฉีดสารทำละลายด้วยสารอะซีตอ� (acetone) เมื่อได้ช่องเปิดขนาดเล็กของฟิล์มสารไวแสงซึ่งมีชั้น SiO_2 อยู่ด้านล่างแล้ว จากนั้นทำการสกัดฟิล์ม SiO_2 ด้วยสารละลายไฮโดรฟลูออริก (HF) เพิ่มขึ้น 5% นาน 25 วินาที และล้างฟิล์มสารไวแสงทั้งหมดออก ดังนั้นฟิล์มบาง SiO_2 ที่ได้มีลักษณะเป็นลวดลายช่องเปิดเป็นร่องขนาดความกว้างแคบที่สุดเฉลี่ยประมาณ $150 \mu\text{m}$ และได้ศึกษาระยะห่างของลวดลายเส้นตรงต่าง ๆ กัน เช่น $190 \mu\text{m}$, $350 \mu\text{m}$ และ $780 \mu\text{m}$ อีกด้วย ได้ศึกษาความหนาของชั้น SiO_2 ที่หนาต่างกัน เช่น 100 nm และ 150 nm ต่อมาก็ได้สร้างชั้นอนอะลูมิเนียม (Al) บนลวดลายช่องเปิด SiO_2 สำหรับเป็นชั้นไฟฟ้าด้านหลังให้กับเซลล์แสงอาทิตย์และผ่านกระบวนการอบความร้อนภายใต้อุณหภูมิ 577°C นาน 30 นาที เพื่อให้เกิดการแพร่ซึมของอะตอม Al ลงไปในแผ่นฐาน $p\text{-Si}$ เป็นบริเวณร่องของ $p^+\text{-Si}$ เกิดเป็นสถานะไฟฟ้าที่ผิวรอยต่อด้านหลังขึ้น (back surface field, BSF)

ในงานวิทยานิพนธ์นี้ได้ศึกษาผลของการผลิตชั้นพาสซิเวชันของช่องเปิด SiO_2 ดังกล่าวทางโครงสร้างด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบสแกนกำลังข่ายสูง(field emission scanning electron microscope, FESEM) จากผลพบว่าบริเวณที่เกิดการผสานระหว่าง Al-Si ที่เกิดจากการแพร่ซึมของ Al ลงไปในหลักแห่งฐาน p-Si มีความกว้างเฉลี่ย $101 \mu\text{m}$ และมีความลึกประมาณ $20 \mu\text{m}$ ที่บริเวณช่องเปิด SiO_2 อีกทั้งได้มีการศึกษาผลการวัดค่าช่วงชีวิตของพาหะด้วยเทคนิค quasi-steady-state photoconductance (QSSPC) ตัวอย่างเซลล์ที่มีชั้นพาสซิเวชัน SiO_2 ควบค่ายเส้นตรงขนาดความกว้างเฉลี่ยเท่ากับ $150 \mu\text{m}$ ระยะห่างเท่ากับ $780 \mu\text{m}$ และขนาดความกว้างของ $p^+ \text{-Si}$ เฉลี่ยเท่ากับ $101 \mu\text{m}$ นั้นมีค่าช่วงชีวิตของพาหะที่สูงที่สุดเท่ากับ $98.18 \mu\text{s}$ จากนั้นนำค่าพารามิเตอร์ดังกล่าวไปคำนวณในแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ PC1D ผลที่ได้พบว่าเซลล์แสงอาทิตย์ที่มีคลาดสายชั้นพาสซิเวชันด้วยการสร้างควบค่ายแบบนี้ดีให้ค่าประสิทธิภาพการแปลงพลังงานเท่ากับ 14.64% ซึ่งสูงกว่าชิ้นงานที่ไม่มีโครงสร้างชั้นพาสซิเวชันอยู่ 1.66%

NATTHAPHONG PHIWPHA : STUDY OF SOLAR CELL EFFICIENCY
FROM PASSIVATION LAYERS BY INKJET PRINTER. THESIS
ADVISOR : ASSOC. PROF. THIPWAN FANGSUWANNARAK, Ph.D.,
138 PP.

INKJET PRINTER/SILICON DIOXIDE/SURFACE PASSIVATION/SOLAR CELL

The small patterns of dielectric thin layers from silicon dioxide (SiO_2) or silicon nitride (Si_3N_4) to be performed between silicon substrate and metal back contacts of p-n junction silicon solar cells can create the built-in potential. This electrical behavior of the dielectric layer is called as “passivation layer” to result in a decrease of the carrier recombination rate due to the decreased carrier recombination velocity and the increased carrier life-time. These results can enhance the efficiency of energy conversion of solar cells. However, a complex procedure based on photolithography is the main limitation to be not commercially available in solar cell industry. In this work, a typical inject printer was adapted and developed for creating small SiO_2 patterns on Si substrates in order to produce the back surface passivation layer in solar cells. To inject directly the solvent of photoresist, this low-cost technique can reduce the complex procedure for fabrication of the patterned passivation layers and can be developed into the further commercial processes.

In the first section of this research, a developed inject printer was used to print the desired patterns on a flat base designed by computer drawing program. Furthermore, the study on fabrication of n-Si diffusion layer on p-Si substrate was investigated with using spin on dopant (SOD) technique in order to perform p/n Si junction. In addition, the synthesis of SiO_2 dielectric material by using the TEOS

solution base was studied and the SiO_2 films on p/n-Si samples were formed at the back of solar cells by a spin coating technique. In order to achieve the SiO_2 groove pattern, firstly, the printer injected acetone solvent on the photoresist which was coated on the SiO_2 films. Secondly, the opened SiO_2 grooves were removed by chemical etching from hydrofluoric acid (5% HF) within 25 seconds. Finally, the all photoresist was removed by its solvent. The narrowest groove width is about 150 μm with varying groove gaps at 190, 350, and 780 μm . The SiO_2 film thickness was obtained at 100 and 150 nm for the functional thin dielectric. Aluminum (Al) for back contacts was screened on the opened SiO_2 layer and then annealed at 577 °C for 30 minutes. Al atoms were diffused into the localized p-Si surface under the thermal annealing to form localized p⁺ Si grooves as same as back surface filed (BSF).

In this thesis, the experimental results of opened SiO_2 passivation layers were verified by a field emission scanning electron microscope (FESEM). It was found that the localized compound Al-Si region with the width size and the depth of 101 μm and 20 μm , respectively results from Al diffusion into p-Si substrate within the opened SiO_2 region. Moreover, life-time measurement of the generated carriers in the samples was studied by using a quasi-steady-state photoconductance (QSSPC) technique. The solar cell containing patterned SiO_2 passivation with the groove width, gap, and localized p⁺ width of 150 μm , 780 μm , and 101 μm , respectively provides the optimum life-time of 98.18 μm . PC1D simulation was used for calculations the energy conversion efficiency of solar cells. It was noticed that the solar cell containing the patterned SiO_2 passivation obtained the efficiency at 14.64% which was higher than the solar cell without any SiO_2 passivation by 1.66%.

School of Electrical Engineering

Academic Year 2013

Student's Signature 

Advisor's Signature 